

J A B M 日本ボンド磁性材料協会 主催
(旧名称 日本ボンド磁石工業協会)

2008 J A B M新春記念講演会 プログラム

「市場変化を捉えた新製品開発を リーダーはどの様に考え行動したか」

当協会は、5月と6月に「技術例会」を12月には、「国際シンポジウム」を開催し、ボンド磁性材料に関連する優れた最新情報をご紹介します。これらの講演会は、技術的内容であるのに対して、今回の新春記念講演会は、ものづくりの先頭に立って新製品開発を推進された方々に、そのものの考え方を学びたいと思います。また、新しい「高加速寿命試験 (HALT)」の概念と日本の現状についてもご講演いただきます。

市場ニーズを反映したタイムリーな製品開発と市場への製品投入を実現し上市することが、経営者のみならず、研究、製造、販売のリーダーにとって重要な課題になっております。本講演会には、技術関係者のみならず、より広い分野の方々のご参加をお待ちしております。

日時 2008年1月18日(金) 講演会 : 13:45~16:15
賀詞交歓会 : 16:30~17:30
場所 東京都荒川区東日暮里5-50-5「ホテルラングウッド」Tel. 03-3803-1234
講演会参加費 会員: 無料 非会員: 10,000円(賀詞交歓会会食代含む)

13:40~13:45 総合進行 : J A B M 企画委員長 石田 知久
開会挨拶 : J A B M 会長 芳賀 美次

1	13:45~14:35	「米国発 HALT試験 とは何か」 — HALT 後進国 日本への警鐘 — 東陽テクニカ(株) HALT技術センター センター長 川上 雅司 1980年代に米国で提唱され全世界に普及している試験。 急勾配で広範な温度変化と6自由度ランダム振動を与えて、 電子機器に内在する弱点を短時間に抽出し、信頼を向上させる 画期的試験方法の概要及び世界と日本の普及状況を示す。
2	14:35~15:25	「何故コニカが開発競争に勝てたか」 元 コニカ(株) 取締役 技術研究所長 内田 康男 ① 取り巻く状況、② ピッカー型とジャスピン型、③ 市場ニ ーズの把握、④ 開発に於けるリーダーシップ、⑤ 発表前の 悪夢、⑥ 国際関係での信頼
3	15:25~16:15	「銀塩写真システムから電子映像システムへの転換から学 んだこと」 — コア技術の構築と市場変化への対応 — 元 富士フィルム(株) 副社長 上田 博造 ① 銀塩システム全盛の最終状況、② 電子映像システムの登場 と初期の影響、③ 対応のスタート、④ その背景、⑤ 初期デ シカメ開発の考え方とシステム考察力、⑥ 銀塩システム VS デジタルシステム、⑦ コア技術構築と市場開拓

16:30~17:30

賀詞交歓会